RESIST COMPOSITION

Patent number:

JP59045439

Publication date:

1984-03-14

Inventor:

HIROSHI ITOO; KAARUTON GURANTO UIRUSON; JIIN EMU JIEI

FUREHITO

Applicant:

IBM

Classification:

- international:

C08K5/00; G03C1/71; G03C1/72; G03C5/24; G03F7/10

- european:

Application number: JP19830109463 19830620 Priority number(s): US19820410201 19820823 Also published as:

EP0102450 (A2)

US4491628 (A1)

EP0102450 (A3)

EP0102450 (B1)

Report a data error here

Abstract not available for JP59045439

Abstract of corresponding document: US4491628

Resists sensitive to UV, electron beam and X-ray radiation with positive or negative tone upon proper choice of a developer are formulated from a polymer having recurrent pendant groups such as tert-butyl ester or tert-butyl carbonates that undergo efficient acidolysis with concomitant changes in polarity (solubility) together with a photoinitiator which generates acid upon radiolysis. A sensitizer component that alters wavelength sensitivity may also be added.

Data supplied from the esp@cenet database - Worldwide

THIS PAGE BLANK (USPTO)

(19 日本国特許庁 (JP)

10特許出願公開

⑩公開特許公報(A)

昭59—45439

⑤Int. Cl.³	識別記号	厅内整理番号	❸公開 昭和59年(1984)3月14日
G 03 C 1/72		7267—2H	• • • • • • • • • • • • • • • • • • • •
C 08 K 5/00	CAF	7342—4 J	発明の数 1
G 03 C 1/71		7267—2H	審査請求 有
5/24		7267—2 H	• • • • • • • • • • • • • • • • • • • •
G 03 F 7/10		7124—2H	(全 6 頁)

50レジスト組成物

②特 顧 昭58—109463

②出 願 昭58(1983)6月20日

優先権主張 **②1982**年 8 月23日 ③米国(US)

30410201 -

の発明者 ヒロン・イトー

アメリカ合衆国カリフオルニア 州サンノゼ・ヴィア・コリナ72

21番地

砂発 明 者 カールトン・グラント・ウイル

ソン

アメリカ合衆国カリフオルニア 州サンノゼ・ハーデイング・ア ベニユー896番地

の出願人 インターナショナル・ビジネス

・マシーンズ・コーポレーショ

アメリカ合衆国10504ニューョ ーク州アーモンク

砂代 理 人 弁理士 岡田次生 外1名

最終質に続く

ण स्रा

1. 発明の名称 レジスト組成物

2. 特許請求の範囲

酸に対して不安定な反復的に存在する核分れした場を有する順合体と、放射に対してさらされたときに酸を生じる光重合開始剤とを含むレジスト 机成物。

3. 発明の詳細な説明

〔技術分野〕

本発明は、レジスト組成物に於て有用な、或る 種の重合体と光陽イオン重合開始剤(cationic photoinition.or)との混合物に係り、更に具体的 に云えば、現像剤を選択することによってポジ型 又はネガ型に働きそして又遊器外線から可観光線 迄の硬々の被反に対して越応し得る、有用な混合 物に係る。それらの中の或る種の混合物は更に、 プラズマ食刻及び反応性イオン食刻に対して耐性 を行している。

〔從來技術〕

ビニル及び複素類の単量体の光陽イオン取合、並びにオニウム塩の光分解により生じた酸によって開始されるオキシラン及びチラン(thirane)の環を含む重合体の光交叉結合は周知である。米国特許第4210449号及び第4273668号明細許は、陽イオン重合及び交叉結合の為の光取合開始剤としてオニウム塩を用いる事を示している。

米国特許第3984253号明細書は、ポジ型の像を形成するために、ジアゾニウム塩の知意酸を生じる化合物を加えることにより、ポリフタルアルデヒドを紫外線、電子ビーム及び X 線に対して感応せしめることを示している。

米国特許第4311782号明細背は、酸を形成する化合物と、周期的に存在するオルトカルポン酸エステルを行する重合性化合物とを含む、ポジ型のレリーフ像を形成するための、放射に対して破応する混合物を示している。

米国特許第4104070号明細書は、修正された像反転プロセス(Modified Image Roversal

Process-MIRP)について記載しているが、その方法は第3成分の添加及び全面露光工程を必要とする。

いずれの従来技術も、本発明に於ける特定の重合体を用いることを示しておらず、又その重合体の枝分れした場を携開(cleave)させて、それらの反復的に存在する場の構造を、重合体被膜の露光組破及び未開光領域の溶解度特性に大きな相違が生じる迄、変化させるために、光陽イオン重合開始剤を用いることについても開示していない。

(発明の概要)

本務明に従って、酸に対して不安定な反復的に存在する核分れした基(recurrent acid labile pendant groups)を、アリールジアゾニウム、ジアリールヨードニウム、又はトリアリールスルホニウム等の金属ハロゲン化物と組合わせることにより、現像利を適切に選択することによつてポジ型又はネガ製のレジストとして働く、紫外線、電子ビーム又はX級に対して適応するレジスト組成物が得られる。上記開始利を含む集合体が基板上

が遺繁外線から可視光線迄の種々の設長に対して 感応する様にされる。例えば、芳春族の環に於け る置換によって、アリールジアゾニウム塩の吸れ 横大が水銀ランプの出力のスペクトルに適合され 得る。更に、ジアリールヨードニウム塩及びトリ アリールスルホニウム塩は、約300nm辺は 取しないが、単に増駿剤成分を更に加えることに よって、中間の紫外線から可削光線迄のより長い 波段に於けるパターン化が可能になる。

反復的に存在する芳音族の魔を含む、本発明に よる組成物は、プラズマ食鋼及び反応性イオン食 刻に対して耐性を有するという、もう1つの銀ま しい特性を在している

ジアリールヨードニウム又はトリアリールスルホニウム企同ハロゲン化物を含む本発明による組成物は、流襲外線に対して著しく終応して、2元よりも呼い被職に於ても重直に近い機の角度を存する傾めて高解像力の像を生じるので、適業外線(200~300mm)による開光とともに用いられたときに特に有用礼つ有利である。

に部い被膜として被覆され、制御された条件の下 でベークされ、放射に対してパターン状にさらさ れ、そして制御された条件のドでポーストペーク される。放射に対してさらされた被膜の部分に於 て、取合体の酸に対して不安定な反復的に存在す る枝分れした基が砂開されて、楓佻を有する反復 的に存在する話が形成され、露光領域がアルカリ 現像刑又は優性溶媒で処理されることにより選択 的に除去される。上記被膜の未露光質域は、無極 性であるために、無極性複雑で処理されることに より遊択的に除去される。従つて、露光領域及び 未開光領域の溶解度特性に大きな相違が存在する ために、現像利を適切に選択することによつて、 像の反転が衝めて容易に違成される。木発明に於 ける溶解特性に相途を生ぜしめる機構は、上記従 来技術の機構と全く異つている。上記従来技術は、 ネガ型の場合には交叉結合に依存してポジ型の場 合には主鎖の劣化に依存しているが、本発明は側 顔の劈開に関連している。

本発明の一実施例に於ては、用いられる組成物

本発明に於ては、放射に対してさらされたとき に強い酸を生じるすべての物質が光低合用始刻で ある俗ることを理解されたい。しかしながら、最 も好ましい光重合開始削は、履機されていない。 及び対称的に又は非対称的に関機された、ジアリ ールヨードニウム塩又はトリアリールスホニウム 塩である。トリアリールセレノニウム塩も有用で ある。屋換されたアリールジアニウム塩も同様に 用いられ得る。本発明に於ける鬼の最も好ましい 対アニオン (gegenanions)は、テトラフルオロ硼 影酸塩、ヘキサンルオロアンチモン酸塩、ヘキサ フルオロ砒穀酸塩及びヘキサフルオロ燐酸塩の卵 キ銷体金属ハロゲン化物であるが、水発明がそれ らの対アニオン及び光重合開始剤に現定されるこ とはない。放射に対してさらされたときに確を生 じる、広範囲の化合物が用いられ得る。本発明に 於て、用いられる開始側の抵は、重合体に対して 1 乃至100重量%の範囲である。その好ましい 湖底範囲は5万至50重量%である。

本発明に於ける好ましい重合体は、効率的に加

酸分解を生じて、前駆動致と極めて異なる極性 (溶解度)を有する生成物を生じる。周期的に存在する枝分れした基を含むビニル取合体である。 しかしながら、本発明は、ビニル付加取合によっ で得られた重合体に限定されない。本発明に於て 有用な重合体を含成するために、総合、重付加及 び付加縮合の如き、他の重合も用いられ得る。

好ましい酸に対して不安定な枝分れした基は、カルボン酸のLert-ブチル・エステル及びフェノールのLert-ブチル・カルボナートであるが、酸に対して不安定である広範囲の基が本発明に於て有用であることを理解されたい。それらは、豊枝樹分野に於て周知である、トリチル、ベンジル及びベンズヒドリルよによる変性体等を含む。

最も好ましい爪合体は、ポリ(p-Lort-プトキシカルボニルオキシ-α-メチルスチレン)、ポリ(p-Lort-プトキシカルボニルオキシスチレン)、ポリ(tort-ブチル-p-ビニルベンゾアート)、ポリ(tort-ブチル-p-イソプロペニルフエニルオキシアセタート)、及びポリ(tort-ブチル・メタクリラ

シアセトフエノンより成る溶液が、1、18gの カリウム・torti-ブトキシドで処理された。その 混合物に、THF中に溶解された10.02gの ジ·tert-ブチル・ジカルボナートが加えられた。 室温で1時間の間提伴された後、その反応混合物 が冷水中に注がれ、铅られた混合物が酢酸エチル を用いて抽出された。標準的処理工程の後、その 溶液が濃縮され、生成物が電温に於て結晶化され た (9.28、収率97%)。50mgの乾燥し たりロド中に溶解さけた3.57gの臭化メチル トリフエニルホスホニウムより成る懸濁被が、1. 12 gのカリウム・Lort-ブトキシドで処理され た。30分間機能された後、20mmの下目で中 に溶解された2・3GRのp-Lort-プトキシカル ポニルオキシアセトフエノンより成る溶液が加え られた。際準的処理工程の後、有優物の間が設備 されて、特性の材料が得られ、その材料がヘキサ ンを密離剤として用いた高圧液体クロマトグラフ イにより楷観されて、1.55g(56%)の純 犂なp-rtert-ブトキシカルポニルオキシ-α-メチ

ート) である。

レジスト組成物を中位の第外線から可視光線迄のより長い波長に対して感応させるために、ジアリールヨードニウム塩又はトリアリールスルホニウム塩とともに用いられる針ましい化合物は、ピレン及びペリレンの如き、多環式の芳香族である。 有効な増感剤である、アクリジン等の他の染料も用いられ得る。本発明が、特定の類の染料の使用に限定されることはない。

(実施例の説明)

次に、前述の好ましい重合体を形成する為の好ましい合成方法を示す。光重合開始剤の合成については、既に文献に詳細に示されている。本発明を用いる為の好ましい方法も、以下に示されている。

Λ. p-tort-ブトキシカルボニルオキシ-α-メ チルスチレンの形成:

Λ-1.

150m g の乾燥したテトラヒドロフラン (T HF) 中に溶解された5.44gのp-ヒドロオキ

ルスチレンが称られた。

Λ-2.

2、2-ビス (p-ヒドロオキシフエニル)プロパンの塩糖触媒劈開により合成された5.64 gのP-ヒドロオキシーα-メチルスチレンと、6.5 gのカリウム・tort-ブトキシドとが、50m gの乾燥した丁HF中に溶解された混合物が、10分間提伴され、それから丁HF中に溶解された12.7 gのジ-tort-ブチル・ジカルボナートより成る物が、20分間機械的に提供された後に、冷水中に注がれた標準的処工程の後、抽出溶剤(酢酸エチル)を蒸発させることにより、相生成物が像エチル)を整理をして用いた高圧液体のロマトグラフィにより精製されて、8.03 g(81%)の純粋なp-tort-ブトキシカルボニルオキシ-α-メチルスチレンが得られた。

B. P-rtert-ブトキシカルポニルオキシスチレンの形成:

乾燥したTHF中に榕解された21.7gのp-

ヒドロオキシベンズアルデヒドより成る溶液が、 電遊祭町気の下で、19.948のカリウム・ tert.-ブトキシドで処理された。 密温で数分間提 伴された後に、12.8gのジ-tert-ブチル·ジ カルボナートが加えられ、その混合物が更に密視 でし時間の問題伴された。漆刷クロマトグラフィ により、反応が完了したことが示され、その混合 物が氷水中に注がれた。その生成物が酢酸エチル を用いて抽出され、水洗いされ、硫酸マグネシウ ム上で乾燥された。溶剤が蒸発されて、p-lorte ブトキシカルボニルオキシスチレンを形成するた 又に直接用いられ得る、39g(99%)の推材 料が得られた。又は、その生成物は、純粋な材料 のp-Lort - ブトキシカルボニルオキシベンズアル デヒドを得るために、商圧被体クロマトグラフィ (HPLC) により符製された。

400m2の電機したTHF中に溶解された34.1gの臭化メチルトリフエニルホスオニウムより成る懸渦被が、窓索雰囲気の下で、10.7gのカリウム・tart・ブトキシで処理された。窓

化合物(0.02mg、単数体に対して1.2モル省)が真空蒸留により導入された。-65℃で溶けたとき、その混合物は混倒し、更に-65℃に放て上時間後に、相分離が観察された。それから、殆ど金賀風が固体化した。26時間後に、アンブルが切られて、低合体が迫りの沈殿物ともでかられた。その重合体がジクロルメタンール中で再次最されることにより構設され、38℃で調整機されて、数平均分で最16900(間オスで現場されて、数平均分で最16900(間オスを成物が得られた。

1) . ポリ (p-tort・ブトキシカルボニルオキシスチレン) の形成:

D-1.

市販のポリ (p-tart-ビニルフエノール)が、相 転移条件のドで、ジ-tert-ブチル・ジカルボナー ト及び炭酸ナトリウムと反応された。得られた重 合体が沈級により存機物の相から分離されて、ア 線で10分間提供された後、その故色の溶液が、 100m4の乾燥したTHF中に溶解された21. 2gのp-tort-ブトキシカルポニルオキシベンズ アルデヒドより成る溶液で処理された。(時間の 間提供された後、その混合物が冷水中に注がれ、 酢酸エチルを用いて抽出された。有優物の相が洗 浄され、磁酸マグネシウム上で乾燥されて、濃縮 された。その祖生成物が商圧液体クロマトグラフ イにより符製されて、16.6g(79%)の鈍 粋なp-tert-ブトキシカルポニルオキシスチレン が行られた。又は、上配租生成物は、破圧蒸留に よつて辨販された。

C. p-tert-ブトキシカルポニルオキシスチレンの形成:

p-tort-ブトキシカルボニルオキシ・α-メチルスチレン(3.000g)が高真空状態の下で乾燥され、重合アンブル中に真空蒸帘された 10mg の乾燥した液状の二酸化磁貨中に溶解されて、黄色の溶液が得られた。液体窒素温度で凍精されたその単量体溶液とともに、三非化硼素エーテル錯

リール・アルキル・カルボナートのカルボニル吸収特性を示す、収取90%以上の生成物が得られた。

D-2.p-tort-ブトキシカルボニルオキシスチレンの遊離基重合:

0.03gのアゾビスイソブチロニトリルを含む5mgのトルエン中に簡解された5gのp-tert-ブトキシカルボニルオキシスチレンより成る溶液が変素の下で65分至75でに加熱された。その混合物は一晩の後に傾めて粘性になり、ジクロルメタンで希釈された後、瓜合体が石油エーテル中に沈殿された。白色の関形物が石油エーテルで洗浄され、更にメタノールで洗浄された。その瓜合体は、4.1g(収率82%)の低量及び4300の数平均分子量(オスモメトリ)を有した。

D-3.p-tert-ブトキシカルボニルオキシスチレンの腸イオン蛋合:

p-tert-ブトキシカルボニルオキシスチレン (1.000g) が高真空状態の下で乾燥され、重合アンプル中に真空蒸留された3.0m g の乾燥した液状の二酸化硫黄中に溶解されて、黄色の溶

被が得られた。被体敦者温度で凍結されたその単低体溶液とともに、三非化硼者エーテル錯化合物(5 μα、単風体に対して 0 ・ 8 モルダ)が真空然間により導入された。取合が一 6 5 ℃で2 7時間の間行われた。アンブルが切られて開かれ、冷か的色の沈殿物として得られた。その所合体が自色の沈殿物として得られた。その所合体が自由ホルム中に溶解され、メタノール中で再沈殿されることにより辞解され、メタノール中で強されて、数平均分不及 2 8 9 0 0 (G P C) を行する 0 ・ 9 0 1 g (9 0 ・ 1 %) の生成物が得られた。

E、レジスト溶液の形成、鮮光及び現像:

1つの典型的な実験に於て、重合体がジグライム (diglyme)又はシクロヘキサノン中に関形物が20重要になる像に溶解され、それにオニウム塩が重合体に対して20重要%の量で加えられる。

その溶液が 0 . 2 μのテフロン・フイルタを綿で遮過される。その溶液をシリコン・ウエハ上に 回転被覆することにより、レジスト層が形成され

ドニウム塩を含むレジスト組成物を313nmの放射に対して感応する様にするために有効である。ペリレンは、ジフエニルヨードニウム塩又はトリフエニルスルホニウム塩を含むレジスト組成物を365nm、104nm及び436nmの放射に対して適応する様にするために有効である。

17. 实施例:

实施例上

る。その被覆された被膜が90万至100℃で3 0分間ベークされる。

次に、上記被限が、Oriel(商品名) 照射数限又はllybrid Tochnology Group Model 3 4 5 - 1 0 (商品名) Xe-llgランプからの勢外線の放射に対して石英マスクを経て露光され、又は 2 5 KeVの 赴査電子ビームの放射或は X 絡の放射に対してハターン状に露光される・

解光された被膜が90万至100℃で5万至1 5 砂間加熱される。

その解光及び加熱された被膜が塩素の水溶液又はアルコール中で現像されて、未解光領域に於ける被膜の厚さを減じることなく高解像力を行するポジ型の像が得られる。上記系は、解光及びベークされた後に、ジクロルメタンの如き無極性溶験、又はヘキサンとジクロルメタンとの総合物中で現像されることによって、容易にネガ型にされ得る。

より長い被長に対する感応性は、上記レジスト 溶液に少量のピレン又はペリレンを加えることに よつて速成され得る。ピレンは、ジフエニルヨー

溶液中で60秒間現像されることにより、 高解像 力を有するポジ製の像が得られた。同様に、ジクロルメタン/ヘキサン中で5万至10秒間現像されることにより、ネガ製の像が得られた。

夹施例 2

ポリ(p-tert-ブトキシカルボニルオキシ-α-メチルスチレン)(数平均分子最46800)がシクロヘキサン中に、関形物が30度最易になる。 協解された。トリフエニルスルボニウム・ヘキサコファーセナートが、銀過されたそのは、カーカーの最近で加えられた。 認過されたを政権を対して2000により、2・4μの原立を有することにが形成された。その破政が行政を対して30分間が一クされ、254mmの射型でで30分間が100でで30分間が100でで30分間が100でで30分間が100でで30分間が100でで30秒間が100でで30秒間が100でで30秒間が100でで30秒間が100でで30秒間が100でで30秒間が100でで30秒間が100でで30秒間が100での角度を有している、高度に近い壁の角度を有して、5秒回が100でで30秒間での角度を有している。

力を行するポジ型の機が得られた。又、ジクロルメタン中で30秒間現像されることにより、ネガ 類の像が得られた。

実施例3

ポリ(p-Lert.-ブトキシカルボニルオキシスチレン)(数平均分子量21600)が1、1、2、2・テトラクロルエタンとジグライム(5:1)との混合物中に、固形物が3重風%になる様に、溶解された。ジフエニルヨードニウム・ヘキサフルオロアーセナート(取合体に対して20重量%)及び少限のペリレンが、低合体の溶液に加えられた。その溶液を打英ウエハ上に2500rpmの速度で同転被優することにより、厚さ1μの破膜が形成された。その破膜が100℃で10分間ベークされ、365nmの狭滞域幅の繋外線の放射に対して25mJ/面の照射ほで解光された。100℃で2分間ボーストベークされた後、繋外線及び赤外線分光分析により、側鎖の病が完全に劈開されていることが確認された。

が20m 風%になる 様に密解された。トリフエニルスルホニウム・ヘキサフルオロアーセナートが 低合体に対して20m 低%の最で加えられた。その溶液をシリコン・ウエハ上に3000 mpmの速 度で回転被置することにより、厚さ0。6 μのレジストの被殴が形成された。その被殴が100℃で30分間ペークされ、勢外線の放射に対して5 5 ml/ dの 燃射量で石英マスクを経で露光された。 その篝光された被殴が100℃で20秒間ボーストベークされ、ジクロルメタン中で30秒間現像 されて、高解像力を有するネガ型の像が得られた。

出願人 インターナショナル・ビジネス・ マシーンズ・コーポレーション 代理人 浄理士 岡 田 次 生 (外工名)

実施例1

ポリ (p-tert-ブトキシカルポニルオキシ·α・ メチルスチレン)(数平均分子及16000)が ジグライム中に、岡形物が20重量%になる様に、 溶解された。トリフエニルスルホニウム・ヘキサ フルオロアーセナートが、無合体に対して20億 **最多の最で加えられた。その溶液をシリコン・ウ** エハ上に3000rpmの速度で回転被殴すること により、厚さ0.6μのレジストの被膜が形成さ れた。その被膜が100℃で30分間ベークされ、 1. 0乃至 0. 2 5 µ の線が得られる様に、 2 5 KeVの走夜電子ピームの放射に対して50、20、10 及び5μC/dの照射量で鍵光された。その露光さ れた被膜が100℃で5秒間ポーストペークされ、 イソプロパノール中で現像されて、高解像力を有 するポジ型の像が得られた。その像の質は、「0 μC/GIに於て良好である。

奖施例5

遊離甚重合により合成されたポリ(tert-ブチル・メタクリラート)がジグライム中に、陽形物

第1頁の続き

⑦発 明 者 ジーン・エム・ジェイ・フレヒト カナダ国オンタリオ州オタワ・ スタンステツド・ロード810番地